時間序列分析 -總體經濟與財務金融之應用-單根與隨機趨勢

陳旭昇

2013.12

- 🚺 定態與非定態自我迴歸模型
- ② 非定態時間序列: 帶有趨勢之序列
- ③ 隨機趨勢造成的問題
- ④ 時間序列的單根檢定
- 3 ADF 檢定的檢定力
- 6 其他單根檢定
- 🥏 如何處理時間序列的單根
- 🔞 去除趨勢後定態 VS. 差分後定態
- Modrick-Prescott 分解
- 10 追蹤資料單根檢定

定態與非定態白我迴歸模型

● 給定簡單的 AR(1) 模型

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim^{i.i.d.} (0, \sigma^2).$$

AR(1) 模型為定態的條件為 $|\beta_1| < 1$ 。

- 當 $|\beta_1| > 1$, AR(1) 模型會是一個爆炸的序列 (explosive series)。
- 當 β₁ = 1 時, AR(1) 模型變成

$$y_t = \beta_0 + y_{t-1} + \varepsilon_t.$$

此模型稱為帶有漂移項 (drift) 的隨機漫步模型 (random walk model), β 。就是模型中的漂移項。

定態與非定態自我迴歸模型

• 如果不具漂移項,

$$y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t,$$

就是一個簡單的隨機漫步模型。且

$$E_t(y_t) = y_{t-1},$$

亦即對於下一期最佳的預測值就是本期的值。

定熊與非定熊白我迴歸模型

假設起始點為 y_0 ,透過反覆疊代,

• 不具漂移項:

$$y_t = \varepsilon_t + \varepsilon_{t-1} + \cdots + \varepsilon_1 + y_0,$$

具漂移項:

$$y_t = \varepsilon_t + \varepsilon_{t-1} + \dots + \varepsilon_1 + y_0 + \beta_0 t.$$

定態與非定態自我迴歸模型

- 具漂移項的隨機漫步模型將有一個固定趨勢項: $\beta_o t$, 若 β_o 大於為零, 則 γ_t 將有一隨時間遞增的固定趨勢; 反之, 則為遞減趨勢。
- 如果隨機漫步模型具漂移項與固定趨勢,則該隨機漫步模型將會有 二次式的固定趨勢 (quadratic trend)。

非定熊時間序列: 帶有趨勢之序列

- 所謂的趨勢 (trend) 係指時間序列資料持續而長期性的移動, 而時間序列資料則沿著它的趨勢上下波動。
- 在時間序列分析中,有兩種可能的趨勢使時間序列為非定態:固定趨勢 (deterministic trend) 與隨機趨勢 (stochastic trend)。

固定趨勢

給定

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 t + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim WN(0, \sigma^2).$$

則

$$E(y_t) = \beta_0 + \beta_1 t,$$

$$E(y_{t+s}) = \beta_0 + \beta_1 (t+s),$$

亦即 $E(y_t) \neq E(y_{t+s}), y_t$ 非定態。 這樣的時間序列稱為去除趨勢後 定態 (trend stationary, TS), 簡稱 TS。

一般去除固定趨勢的方法為估計固定趨勢模型後,得到殘差序列,

$$\hat{\varepsilon}_t = y_t - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 t$$

就是去除固定趨勢後的定態時間序列。

所謂的隨機趨勢就是時間序列資料持續而長期性的隨機移動。以總體經濟學的解釋來看,意指經濟體系中的外生衝擊 (exogenous shocks) 對於總體經濟變數的影響為恆久 (permanent)。任意一次的隨機衝擊就會造成時間序列資料持續而長期性的改變。

給定 AR(p) 模型

$$\beta(L)y_t = \beta_0 + \varepsilon_t.$$

如果多項式方程式

$$\beta(z) = 1 - \beta_1 z - \beta_2 z^2 - \dots - \beta_p z^p = 0$$

有一個根為 1, 則我們稱此 AR(p) 為一具有單根 (unit root) 的序列。

- 如果時間序列 y_t 具有單根, 則 y_t 具有隨機趨勢 (stochastic trend)。 一般來說,單根與隨機趨勢被視作相同的概念。
- 單根的概念對於近代的總體經濟學的發展具有舉足輕重的影響。單 根原本只是統計學上的性質,然而, Nelson and Plosser (1982) 在 Journal of Monetary Economics 發表 "Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series"一文後, 改變了實證總體經濟學的 方向。

- 在過去,人們對於第一章中的總體經濟時間序列均認定為具有固定 趨勢,因此,一般的作法是以固定趨勢模型去除掉總體經濟時間序列 的固定趨勢後,序列就是定態,可予以分析。
- 然而, Nelson and Plosser (1982) 發現, 大多數的總體經濟時間序列 均具有隨機趨勢, 因此僅去除掉總體經濟時間序列的固定趨勢, 並未 去除時間序列的隨機趨勢, 之後的分析就大有問題。

隨機趨勢造成的問題

隨機趨勢造成的問題有三:

- 以自我迴歸模型估計隨機趨勢序列, 所得到的自我迴歸係數有小樣本向下偏誤 (small-sample downward bias)。
- ② 以自我迴歸模型估計隨機趨勢序列,所得到自我迴歸係數的 t-統計量 (t-statistic)的極限分配不為標準常態。
- 虚假迴歸 (spurious regression)。

小樣本向下偏誤

以 AR(1) 為例, 如果時間序列具有隨機趨勢, 亦即實際的資料生成過程 (data generating process) 為

$$y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t,$$

然而我們不知道真正的資料生成過程, 卻以 AR(1) 模型估計之:

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 y_{t-1} + \varepsilon_t,$$

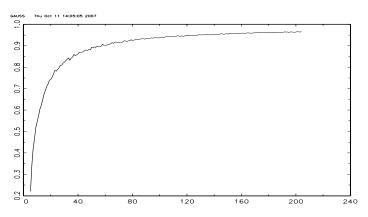
因此, 在真正的 $\beta_1 = 1$ 的情形下, 我們所估計的 $\hat{\beta}_1$ 將有向下偏誤:

偏誤 =
$$E(\hat{\beta}_1) - \beta_1 \approx (1 - \frac{5 \cdot 3}{T}) - 1 = -\frac{5 \cdot 3}{T}$$
,

隨著樣本越小,偏誤越大。

小樣本向下偏誤

 $圖: E(\hat{\beta}_1)$ 與樣本大小



給定資料生成過程為

$$y_t = \beta_1 y_{t-1} + \varepsilon_t,$$

欲檢定虛無假設: $\beta_1 = B$, 其中 B 為真實的 β_1 之值。

• 若 -1 < B < 1, 亦即 y_t 為定態, 則 t-統計量的極限分配為標準常態,

$$t = \frac{\hat{\beta}_1 - B}{\sqrt{\widehat{Var(\hat{\beta}_1)}}} \xrightarrow{d} N(0,1),$$

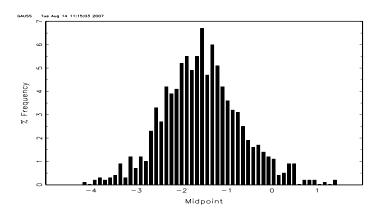
■ 當 B = 1, 亦即 y_t 有隨機趨勢 (單根), 則t-統計量

$$t = \frac{\hat{\beta}_1 - B}{\sqrt{\widehat{Var}(\hat{\beta}_1)}} = \frac{\hat{\beta}_1 - 1}{\sqrt{\widehat{Var}(\hat{\beta}_1)}}$$

的極限分配不為標準常態。

• 以 T = 1000 (大樣本) 為例, 在 $\beta_1 = 1$ 的虛無假設下以電腦模擬上述 t-統計量, 所得的 t-統計量之抽樣分配, 該分配顯然不是標準常態分配 (別忘了標準常態分配的均數為零)。

圖:模擬在虛無假設 $\beta_1 = 1$ 下 t-統計量之抽樣分配



虚假迴歸

- 虛假迴歸 (spurious regression) 是由 Granger and Newbold(1974) 所提出。
- 一般而言, 如果有兩個獨立且定態的時間序列 x_t 與 z_t , 由於獨立之 性質,則以下的迴歸分析

$$x_t = a_0 + a_1 z_t + u_t$$

應該會得到

- a, 的估計式不具統計上顯著,
- (2) 判定係數 R² 非常低。

虚假迴歸

• 如果 x_t 與 z_t 雖然獨立但卻都具隨機趨勢, 則他們發現, 在多次電腦 模擬中, 在 5% 的顯著水準下, 可以拒絕 $a_1 = 0$ 的虛無假設的機會 (百分比) 竟高達 75%, 而 R² 也異常地高。亦即, 兩個毫不相干的變 數,只因為具有隨機趨勢,就會讓我們估計出一個不存在的相關性, 這就叫做虛假迴歸。

- 既然時間序列存在單根會造成許多問題,一如 Nelson and Plosser (1982) 所揭示,如果我們忽略總體經濟變數具有單根之問題,則過去實證總體經濟研究中所得到的統計推論都是錯的。
- 我們接下來的問題就是,如何檢定單根的存在。一個最常使用的檢定稱為 Augmented Dickey-Fuller 檢定 (ADF test)。

考慮一個 AR(k) 模型:

$$\varphi(L)y_t = \mu + \varepsilon_t,\tag{1}$$

 $\varepsilon_t \sim^{i.i.d.} (o, \sigma^2),$

其中

$$\varphi(L) = 1 - \varphi_1 L - \dots - \varphi_k L^k. \tag{2}$$

性質 (Dickey-Fuller 重新參數化)

令 p = k - 1, 我們可以透過計算得到

$$\varphi(L) = (1-L) - \alpha_0 L - \alpha_1 (L-L^2) - \cdots - \alpha_p (L^p - L^{p+1}),$$

其中係數 α_i 符合

$$\alpha_{o} = -1 + \sum_{j=1}^{k} \varphi_{j},$$

$$\alpha_i = -\sum_{j=i+1}^k \varphi_j$$
, for $i = 1, 2, \dots, p$

性質 (Dickey-Fuller 重新參數化 (續))

因此,根據第(2)式,式(1)可改寫成:

$$\Delta y_t = \mu + \alpha_0 y_{t-1} + \alpha_1 \Delta y_{t-1} + \dots + \alpha_p \Delta y_{t-p} + \varepsilon_t.$$
 (3)

第 (3) 式稱為第 (1) 式的 Dickey-Fuller 重新參數化。

• 如果 $\varphi(z) = 0$ 有一個根落在單位圓之上, 亦即 $\varphi(1) = 0$, 則稱 y_t 具有單根。注意到

$$\varphi\big(1\big)=\big(1-1\big)-\alpha_{\scriptscriptstyle 0}-\alpha_{\scriptscriptstyle 1}\big(1-1^2\big)-\cdots-\alpha_{\scriptscriptstyle p}\big(1^p-1^{p+1}\big)=-\alpha_{\scriptscriptstyle 0},$$

• 檢定 y_t 是否具有單根, $H_o: \varphi(1) = o$, 就等同於檢定第 (3) 式中 $H_o: \alpha_o = o$ 之假設。

定義 (Augmented Dickey-Fuller 檢定)

ullet 若虛無假設為 y_t 具單根, 對立假設 y_t 為定態, 考慮以下迴歸式

$$\Delta y_t = \beta_{\rm o} + \delta y_{t-1} + \gamma_1 \Delta y_{t-1} + \cdots + \gamma_p \Delta y_{t-p} + u_t,$$

並檢定 $H_0: \delta = o$ vs. $H_1: \delta < o$ 。

定義 (Augmented Dickey-Fuller 檢定 (續))

● 若虛無假設為 y_t 具單根, 對立假設 y_t 為去除趨勢後定態。 考慮以下迴歸式

$$\Delta y_t = \beta_{\rm o} + \alpha t + \delta y_{t-1} + \gamma_1 \Delta y_{t-1} + \cdots + \gamma_p \Delta y_{t-p} + u_t,$$

並檢定 $H_o: \delta = o$ vs. $H_1: \delta < o$ 。其中, $\gamma_1 \Delta \gamma_{t-1} + \cdots + \gamma_p \Delta \gamma_{t-p}$ 稱為 ADF 檢定的 增廣項 (augmented part), 增廣項的最適落後期數 p 可利用 AIC 或是 BIC (SIC) 決定之。

在 ADF 檢定中, 檢定 $H_o: \delta = o$ 的 t 統計量又稱 ADF-t 統計量,

$$\mathsf{ADF-}t = \frac{\hat{\delta}}{\sqrt{\widehat{Var}(\hat{\delta})}}.$$

在虛無假設下, ADF-t 統計量的實際抽樣分配不為 t 分配, 其極限分配也不是標準常態 N(0,1), 而是一個非常態的特殊分配, 其臨界値如下表所示。

表: ADF-t 統計量的大樣本臨界值

ADF 迴歸模型	10%	5%	1%
只有截距項 (β _o)	-2.57	-2.86	-3.43
截距項 (β_o) 與固定趨勢 (t)	-3.12	-3.41	-3.96

因此, ADF-t 檢定是一個左尾檢定, ADF-t 統計量越小, 越能提供證據拒絕「具有單根」的虛無假設。

如果移去 ADF 迴歸式中的所有增廣項,

$$\Delta y_t = \beta_0 + \alpha t + u_t,$$

這就是 Dickey and Fuller(1979) 原始的概念, 因此我們又將不具增廣項的 ADF 檢定稱做 Dickey-Fuller 檢定, 簡稱 DF 檢定。放進增廣項的目的在於控制殘差項 u_t 中可能的序列相關。

ADF 檢定的檢定力

- ADF 檢定雖然是最常用的單根檢定,但是其檢定力在真正的 AR(1) 係數很接近 1 (但不等於 1) 時非常低。也就是說, ADF 檢定犯型 II 誤 差的機率非常高 (實際上是定態時間序列, 卻無法拒絕具有單根的 虛無檢定)。
- 假設真正的資料過程為定態的 AR(1) 模型:

$$y_t = \beta_1 y_{t-1} + \varepsilon_t$$
, $\varepsilon_t \sim^{i.i.d.} N(o, \sigma^2)$,

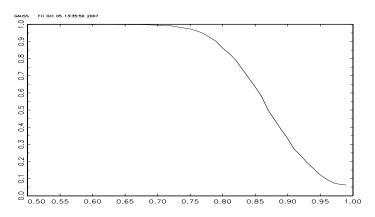
其中 $|\beta_1| < 1$ 。

ADF 檢定的檢定力

- 以電腦模擬 ADF 檢定在不同的對立假設下 (亦即不同的 $0.5 \le \beta_1 \le 1$) 的檢定力 (顯著水準為 5%), 當 $\beta_1 = 0.5$ 左右時, ADF 檢定的檢定力極高 (接近 1)。
- 隨著 β_1 變大, 檢定力亦隨之下降, 舉例來說, 當真正的 β_1 = 0.93 左右, 檢定力只有 10%, 亦即 ADF 檢定犯型 II 誤差的機率高達 90%, 每 100 個定態 AR(1) 序列有 90 個會因無法拒絕單根而被誤判為 I(1) 序列。

ADF 檢定的檢定力

圖: ADF 檢定之檢定力 (橫軸為 AR(1) 係數 β_1 , 縱軸為檢定力)



其他單根檢定法

表:其他單根檢定

檢定方法	提出人
PP 檢定	Phillips and Perron (1988)
KPSS 檢定	KPSS(1992)
DF-GLS 檢定	Elliott et al.(1996)
ERS 檢定	Elliott et al.(1996)
NP 檢定	Ng and Perron(2001)

其他單根檢定

● ADF 檢定中的增廣項是為了控制殘差項的序列相關。 Phillips and Perron(1988) 則以無母數 (non-parametric) 之方法處理此問題, 稱 之為 Phillips-Perron (PP) 檢定。然而, 根據類似的電腦模擬分析顯 示, PP 檢定與 ADF 檢定一樣, 都有「低檢定力」之問題。

一般的單根檢定都是將「序列具有單根」放在虛無假設,而對立假設 則是「序列為定態」。而 KPSS 檢定正好相反,其虛無假設是「序列為 定態」。因此, 有些學者如 Cheung and Chinn (1996) 主張, 應該同 時考慮將「序列具有單根」放在虛無假設與將「序列為定態」放在虛 無假設的檢定,以做為一種「確認分析」(confirmatory analysis)。唯 有兩種不同檢定具有一致結果,才能「確認 | 序列是否為單根之結 論。

Maddala and Kim (1998) 卻有不同之看法。他們認為給定 KPSS 檢定與 ADF/PP 檢定一樣, 檢定力也不高, 這種確認分析並沒有太大意義。他們援引文獻上的電腦模擬分析以支持此論點。簡單地說, 「確認分析」猶如問道於兩個盲人 (There is no chance to get better since you are guided by TWO Blind MEN)。

除了「低檢定力」的問題之外、ADF/PP等傳統檢定還存在著「高型Ⅰ 誤差的扭曲 | (large size distortion)。 Schwert(1989) 與 DeJong, Nankervis, Savin and Whiteman (1992) 均發現實際資料生成過程 (data generating process) 中的移動平均誤差 (moving-average component) 會導致傳統 ADF/PP 單根檢定之型 I 誤差的扭曲。

Ng and Perron (2001) 除了修正傳統的單根檢定,對於選取增廣項 最適落後期數的資訊準則也有所修正,稱之為修正 AIC (modified AIC, MAIC) 與修正 SIC (modified SIC, MSIC)等。

● DF-GLS, ERS, 以及 NP 檢定為最近提出來的一些新檢定, 意圖解決 傳統 ADF/PP 單根檢定之問題。然而,一如 Maddala and Kim (1998) 所指出, 大多數的新檢定或許彌補了 ADF/PP 檢定的原有缺 點,卻也存在若干新的缺失。目前為止似乎還沒有一個簡單好用且 能夠解決所有問題的優質檢定。譬如說,有的新檢定引進了一些不 易決定的新參數,有的檢定則有計算上的困難,或是步驟太過繁複。 此外,這些新檢定的普遍性亦不足,僅在某些特定的資料產生過程或 是特定的模型設定下表現較好。

即使各種新檢定並不能適用在每一個模型設定,這些新檢定的表現 都遠勝過傳統 ADF/PP 檢定。因此, Maddala and Kim (1998) 建議 應該揚棄 ADF/PP 檢定 (it is time to completely discard the ADF/PP tests).

如何處理時間序列的單根

一個具有單根的時間序列如

$$y_t = \beta_0 + y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim^{i.i.d.} N(0, \sigma^2).$$

取一階差分

$$\Delta y_t = y_t - y_{t-1} = \beta_0 + \varepsilon_t$$

就變成一個定態的時間序列,因此,將具單根的數列取一階差分就能 夫除其隨機趨勢。

● 一般來說,如果一個非定態的時間序列取一階差分後就變成定態的 時間序列, 我們稱此時間序列為差分後定態 (difference stationary)

如何處理時間序列的單根

- 對於一階差分後定態的時間序列以 $y_t \sim I(1)$ 表示之, 意指一階自積 (integrated of degree one), 亦即, 經過一階差分後為定態。
- 如果時間序列不具隨機趨勢,本來就是一個定態序列,以 $y_t \sim I(o)$ 表示之。
- 如果時間序列經過 d 階差分後方為定態, 亦即 $\Delta^d y_t \sim I(o)$, 則以 $y_t \sim I(d)$ 表示之。
- 由於在對 *I*(1) 時間序列作統計分析時,存在之前提過的三大問題, 一般的作法是: 一旦發現時間序列包含隨機趨勢,就予以差分,並以 差分後之序列作統計分析。

去除趨勢後定態 VS. 差分後定態

去除趨勢後定態 (TS) 與差分後定態 (DS) 兩種序列具有完全不同的性質, 將該序列轉換為定態的方式亦不同。

● 如果我們將 TS 序列予以一階差分,造成的問題是引進了一個不可逆的 MA,舉例來說,

$$y_t = y_0 + a_1 t + \varepsilon_t$$

一階差分後,

$$\Delta y_t = a_1 + \varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}$$

變成一不可逆之 MA 序列, 使得 Δy_t 無法表示為 AR 模型。

去除趨勢後定態 VS. 差分後定態

● 反之, 如果我們將一個 DS 序列去除掉固定趨勢後, 未必能夠得到定態序列。舉例來說,

$$y_t = y_0 + a_0 t + \sum_{i=1}^t \varepsilon_i$$

減去 $(y_o + a_o t)$ 後,

$$\tilde{y}_t = y_t - (y_0 + a_0 t)$$

$$= \sum_{i=1}^t \varepsilon_i$$

為一非定態序列。

去除趨勢後定態 VS. 差分後定態

- 由於目前並不存在一個最具檢定力 (uniformly powerful) 的單根檢 定,即使我們無法拒絕序列具有單根,並不代表序列一定有單根。
- 對於一個無法拒絕具有單根的序列,雖不隱含該序列一定具有單根, 但是從另一個角度來說, I(1) 序列會是該序列的一個良好近似, 我們 可以將該序列"視為"一個具隨機趨勢的序列。因此,我們可以依照一 般作法,將該序列差分後再予分析。

- 給定序列 y_t 為非定態序列, 我們可以將其分解 (decompose) 成定 態部分 (stationary component) 與非定態部分 (nonstationary component).
- 舉例來說,實質景氣循環 (real business cycle, RBC) 模型認為實質 產出受到恆常性衝擊 (permanent shocks) 與暫時性衝擊 (temporary shocks) 的交互影響, 使得實質產出沿著一個隨機趨勢 上下波動。因此,將實質產出分解成定態部分與非定態部分以 RBC 的觀點來看, 就是分解成趨勢 (trend) 與波動 (cycle) 兩部分。

- 實質景氣循環文獻上最常用的分解方法稱為 Hodrick-Prescott 分解 (Hodrick-Prescott decomposition), 又稱 Hodrick-Prescott 濾器 (Hodrick-Prescott filter), 簡稱 HP 分解 (HP decomposition) 或是 HP 濾器 (HP filter)
- HP 分解的概念為, 在 y_t 中分解出一個恆常序列 (隨機趨勢) TR_t 以極小化 y_t 圍繞著 TR_t 的變異數:

$$\sum_{t=1}^{T} (y_t - TR_t)^2.$$

- 然而, 如果我們只有以上的目標函數, 則設定 $TR_t = y_t$ 就能達到極小値, 不但沒意義, 也使 TR_t 的波動過大。
- 因此,我們的目標函數加入一個懲罰項,亦即

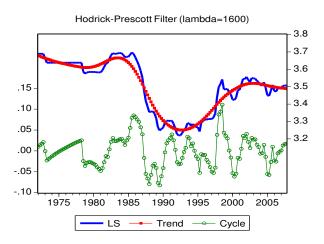
$$TR_{t}^{HP} = \arg \min_{\{TR_{t}\}_{t=1}^{T}} \sum_{t=1}^{T} (y_{t} - TR_{t})^{2}$$

$$+ \lambda \sum_{t=2}^{T-1} \left[(TR_{t+1} - TR_{t}) - (TR_{t} - TR_{t-1}) \right]^{2}.$$

對於過度波動的 TR_t 予以懲罰。

- 參數 λ 控制了 TR_t 的平滑程度, λ 越大, TR_t 就越平滑。
- Hodrick and Prescott (1997) 建議設定 λ 為 100 (年資料), 1600 (季 資料) 以及 14400 (月資料)。而 $CY_t^{HP} = y_t TR_t^{HP}$ 就是 y_t 的波動部分。

圖: Hodrick-Prescott 分解: 新台幣兌美元匯率



常用的追蹤資料單根檢定

- 已知單一序列的單根檢定有低檢定力的問題。既然不可能增加單一時間序列的樣本大小,一種可能的解決方法就是使用追蹤資料。
- 舉例來說,在檢定購買力平價說時,特定國家貨幣對美元的實質匯率 追朔到 Bretton Woods System 崩潰後的浮動匯率期間,以月資料 來說,迄今最多只有 310 個樣本點 (1972:1-2007:10),然而,如果考 慮七大工業國 (美國為基準),則可以得到 6 × 310 = 1860 個樣本點。
- 文獻上最常用的追蹤資料單根檢定 (panel unit root tests) 為
 - Levin,Lin and Chu(2002) test (LLC)
 - Im,Pesaran and Shin(2003) test (IPS)

常用的追蹤資料單根檢定

考慮以下的追蹤資料 ADF 迴歸式

$$\Delta y_{it} = a_{io} + \gamma_i y_{it-1} + a_{i2}t + \sum_{j=1}^{P_i} \beta_{ij} \Delta y_{it-j} + \varepsilon_{it}$$

其中 i = 1, 2, ...n.。LLC 檢定與 IPS 檢定有兩大的不同處。

- LLC 檢定混合的是資料, 而 IPS 檢定混合的是檢定量。
- ◎ 對立假設不同

常用的追蹤資料單根檢定

● LLC 檢定

$$H_0: \gamma_1 = \gamma_2 = ... \gamma_n = \gamma = 0$$

 $H_1: \gamma_1 = \gamma_2 = ... \gamma_n = \gamma < 0$

② IPS 檢定

$$H_0: \gamma_1 = \gamma_2 = ... = \gamma_n = \gamma = 0$$

 $H_1:$ 至少有一個 γ_i 不為零

顯而易見地, LLC 檢定的對立假設要求所有的 γ_i 都相等, 限制較大, 而 IPS 檢定的對立假設限制較小。

IPS 追蹤資料單根檢定

在此只簡單介紹如何執行 IPS 檢定。

- ① 對每一個 i, 估計 γ_i 且計算 ADF_t , 以 t_i 表示, 其中 i = 1, 2, ...n.
- ❷ 將 ADF_t 統計量混合 (pool) 在一起

$$\bar{t} = \frac{\sum_{i=1}^{n} t_i}{n}$$

建構 Z_{thar} 統計量:

$$Z_{tbar} = \frac{\sqrt{n} \left(\bar{t} - E[\bar{t}]\right)}{\sqrt{\mathsf{Var}(\bar{t})}}$$

其中 $E[\bar{t}]$ 與 $Var(\bar{t})$ 之値可由 Im et al. (2003) 查得

IPS 追蹤資料單根檢定

● Im et al. (2003) 證明

$$Z_{tbar} \stackrel{d}{\rightarrow} N(0,1),$$

且提供了小樣本檢定臨界值

● 我們也可以利用蒙地卡羅模擬或是 Bootstrap 來自行計算臨界值 (參見第 14 章)

追蹤資料單根檢定之性質

● IPS 檢定的對立假設為

 H_1 : 至少有一個 γ_i 不為零

然而,我們無法得知道到底使那一個 γ_i 不為零。

- ❷ 追蹤資料檢定的大樣本性質仍有待商榷。可能的漸近性質為
 - (a) T 固定, $N \to \infty$
 - (b) $T \to \infty$, N 固定
 - (c) $T \to \infty, N \to \infty \ \overline{\square} \ \frac{T}{N} \to c$

因此, 在不同的漸近假設下, 臨界值亦將有所不同。

追蹤資料單根檢定之性質

常用的追蹤資料單根檢定 (LLC, Breitung, IPS, Fisher-ADF, Fisher-PP, Hadri) 都假設誤差項 $\{\varepsilon_{it}\}$ 無序列相關且無當期相關 (serially uncorrelated and contemporaneously uncorrelated), 亦 即,

$$E(\varepsilon_{it}\varepsilon_{jt})=o.$$

序列相關的問題可以用增廣項 (augmented part) 予以解決,然而, 若 $E(\varepsilon_{it}\varepsilon_{it}) \neq o$, 則以上的 LLC, Breitung, IPS, Fisher-ADF, Fisher-PP 以及 Hadri 檢定可能會導致錯誤的統計推論。文獻上如 O'Connell (1998)與 Pesaran (2006)都曾指出,如果追蹤資料單根檢定忽略了 誤差項的當期相關,則會產生極高的型 I 誤差機率 (substantial size distortions).

追蹤資料單根檢定之性質

- 對於 $E(\varepsilon_{it}\varepsilon_{it}) \neq o$ 的問題, 目前文獻上的解決方法可以參考
 - (a) Maddala and Wu (1999)
 - (b) Pesaran (2006)